

積層陶瓷電容表面瑕疵之檢測與分類

邱奕契, 林憲忠

機械工程學系

工學院

chiou@chu.edu.tw

摘要

本研究利用色彩模型轉換、影像分割、瑕疵偵測、特徵抽取、瑕疵分類等技術發展一套積層陶瓷電容（MLCC）表面瑕疵之檢測與分類系統。完成之系統可針對陶瓷體破損、端電極損傷、表面缺損、陶瓷體沾污、端電極沾污、浸鍍不良、端電極刮傷、氣泡、皺褶等9種經常出現在MLCC表面上的瑕疵進行偵測與分類。

關鍵字：MLCC、影像分割、特徵抽取、瑕疵分類